View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

brought to you by

103

Vol. 39 No. 4 Aug. 2010

SURFACE TECHNOLOGY

应用技术

# 拉曼光谱表征无氢类金刚石薄膜的新方法

张玲, 赖起邦, 崔万国, 王辅明(厦门大学 物理系, 厦门 361005)

[摘 要] DLC 薄膜的拉曼光谱表征主要依靠 D 峰和 G 峰的强度比值(*I*<sub>D</sub>/*I*<sub>C</sub>) 来定性判断 sp<sup>3</sup> 含量,但当 sp<sup>3</sup> 所占百分比高于 20% 时,*I*<sub>D</sub>/*I*<sub>C</sub> 值对 sp<sup>3</sup> 含量的变化不敏感,判断的误差很大。采用直流磁控溅射和多弧离 子镀制备了 一系列无氢 DLC 薄膜样品,并测量了样品的拉曼光谱和维氏硬度。通过数据分析,发现薄膜硬度和 拉曼光谱中的 G 峰半峰宽具有很好的相关性,因而提出通过 G 峰半峰宽来定量判断 DLC 薄膜中 sp<sup>3</sup> 含量的拉曼 光谱表征新方法。

[关键词] 类金刚石薄膜; 拉曼光谱; sp<sup>3</sup> 含量; G 峰 [中图分类号]TB43 [文献标识码]B

[文章编号]100+3660(2010)04-0103-03

# New Method for Analyzing Raman Spectra of Hydrogen-free Diamond-like Carbon Films

ZHANG Ling, LAI Qi-bang, CUI Wan-guo, WANG Fu-ming

(Physics Department of Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**[Abstract]** The ratio between intensities of the D peak and the G peak  $(I_D/I_C)$  is used to estimate sp<sup>3</sup> content of the DLC films. However, this method has limitations. When sp<sup>3</sup> content exceeds 20%,  $I_D/I_C$  has very low correlations with the content of sp<sup>3</sup>, therefore, estimation of sp<sup>3</sup> content using this method could lead to significant error. DG-magnetron sputtering and multiple-arc ion plating are used to deposit a series of hydrogen-free diamond-like carbon samples. Raman spectra and Vickers hardness of samples were measured and analyzed. A strong correlation between the hardness and G-peak's full width at half maximum (FWHM) was discovered. The results show that it's feasible to measure the content of sp<sup>3</sup> by using the G-peak's FWHM in Raman spectra.

[Key words] DLC; Raman spectra; sp<sup>3</sup> content; G peak

类金刚石薄膜(DLC) 是一系列含有  $sp^3 \pi sp^2$  键 的非晶碳膜,它有着和金刚石膜非常接近的性质—— 高硬度、耐磨损、低摩擦因数、高电阻率、高透光率和高 化学稳定性等<sup>[1-2]</sup>,因此被广泛应用于机械、电子、光 学和医学等各个领域,其在半导体光电领域的应用也 引起了广泛关注<sup>[3-5]</sup>。类金刚石膜主要分为 2 种:含 氢 DLC(acC: H)和无氢 DLC(tacC),文中仅研究无氢 类金刚石膜的拉曼表征。

无氢类金刚石薄膜主要由金刚石键组态 $(sp^3)$ 和 石墨键组态 $(sp^2)$ 组成 $,sp^2$ 和 $sp^3$ 键比例的多少,将决

[作者简介] 张玲(1985-), 女, 福建人, 硕士生, 主攻 DLC 薄膜的半导体光电性质。

[通讯作者]王辅明(1966-),男,福建人,副教授,主要研究方向为半导体材料与器件。

1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定 DLC 膜的成膜质量、硬度、禁带宽度等多项性质。 对于无氢 DLC 膜, C — C sp<sup>3</sup> 键比例越高, DLC 膜与金 刚石膜的性质就越接近。因此, 在 DLC 薄膜的研究工 作中, sp<sup>3</sup> 含量的测量或者定性判断是一项最基本的表 征工作。sp<sup>3</sup> 含量的测量方法有多种, 其中拉曼光谱测 量由于具有测试简易、花费时间短、对样品无损伤等优 点而被广泛采用<sup>[6-7]</sup>。目前 DLC 薄膜的拉曼表征主 要依靠 D 峰和 G 峰的强度比值( $I_{\rm D}/I_{\rm C}$ ) 来判断 sp<sup>3</sup> 的 含量, 较低的比值意味着较高的 sp<sup>3</sup> 含量, 但在 sp<sup>3</sup> 所 占百分比高于 20% 的区域,  $I_{\rm D}/I_{\rm C}$  值和 sp<sup>3</sup> 含量的相

<sup>[</sup>收稿日期] 2010-04-05; [修回日期] 2010-06-10

<sup>[</sup>基金项目]福建省半导体照明工程技术研究中心资助项目(2006H0092)

关度很低,所以  $I_{\rm D}/I_{\rm C}$  值只能用来定性判断 sp<sup>3</sup> 的含 量<sup>[8]</sup>。文中采用直流磁控溅射和多弧离子镀制备一系 列无氢 DLC 薄膜样品、测量 DLC 薄膜的拉曼光谱和 硬度,发现G峰半峰宽与硬度之间存在很好的线性关 系。基于 DLC 薄膜的硬度与  $sp^3$  含量的线性关系<sup>[1]</sup>, 笔者提出采用 G 峰半峰宽来定量估算无氢 DLC 薄膜  $sp^3$  含量的拉曼表征方法。

#### 实验 1

### 1.1 样品的制备

分别采用直流磁控溅射和多弧离子镀沉积了一系 列样品。磁控溅射设备为北京创威纳科技有限公司生 产的JS2S-80D 型溅射台, 工作电源为2 000 W 直流电 源。溅射时施加直流功率 400~800 W, 部分样品的衬 底在 120 ℃温度下烘烤 10 min 后再开始沉积。离子 镀设备为 CAP-4 多弧离子镀膜机, 工作电源为 30 kW 脉冲电源,可承载最高电压 1 100 V,最高电流 30 A。 镀膜时施加脉冲偏压 90~ 200 V,脉冲占空比为 74%。 溅射靶材都采用高纯石墨靶,通氩气作为辅助溅射气 体。样品均生长在 n 型硅基片上, 基片经标准清洗后 镀膜,膜厚为 300~ 400 nm。

1.2 样品的测试

拉曼光谱测试采用英国 RENSISHAW 公司的 R1000 型共显焦拉曼谱仪, 激发光源为 Innova 200 型 氩离子激光器,激发波长为 514.5 nm。激光功率为 6 mW, 到达样品的功率约为 20 mW, 测试范围为 1 000  $\sim 1 800 \text{ cm}^{-1}$ 

硬度测试采用华银 HV-1000 型显微硬度计, 施加 10g载荷值,将顶角为136°的金刚石方形锥压入器压 入薄膜表面, 悬停 10 s, 测得样品压痕凹坑的表面积, 将载荷值除以该表面积即得维氏硬度。

#### 结果与讨论 2

### 2.1 高斯方法拟合拉曼光谱

DLC 薄膜的拉曼光谱由 1 350 cm<sup>-1</sup> 附近的 D 峰  $\pi 1580 \text{ cm}^{-1}$ 附近的G峰组成。图 1a 和图 1b 分别给 出了低 sp<sup>3</sup> 含量和高 sp<sup>3</sup> 含量样品的拉曼光谱, 图 1b 中的 D 峰几乎完全消失,只剩下明显的 G 峰。高斯拟 合方法采用 2 个高斯曲线分别拟合拉曼光谱中的 D 峰和 G 峰, 图 1a 展示了拟合 D 峰和 G 峰的高斯曲线 以及二者的叠加。通过高斯拟合,可以得到 D 峰、G 峰的覆盖面积及 G 峰的半峰宽等信息。

# 2.2 $I_{\rm D}/I_{\rm G}$ 值与硬度的关系





Fig. 1 Raman spectra of DLC sample and its Gaussian fit 盖的面积,从而计算出 D 峰和 G 峰的强度比值 I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>。 图 2 为硬度与  $I_{\rm D}/I_{\rm G}$  值的关系图。



图 2 维氏硬度与 In/Ic 的关系

Fig. 2 Vickers hardness versus  $I_{\rm D}/I_{\rm G}$  ratio

图 2 显示, 硬度值超过 1 700 HV, /p//G 值低于 0.25时, Ib/ Ic 值不再随硬度值发生显著变化, 这一结 果与其他相关文献的研究结果一致<sup>[8]</sup>。无氢 DLC 膜 的硬度越高,薄膜中 $C - C sp^3$  键比例越高,二者之间 存在线性关系<sup>[1]</sup>。因此,可以通过研究拉曼光谱与硬 度的相关性, 来研究拉曼光谱与 sp<sup>3</sup> 含量的关系。根 据文献[1]和[8], I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>值达到0.25时, DLC 膜的 sp<sup>3</sup> 所占百分比约为 20%;所以,  $I_{\rm D}/I_{\rm G}$  值只能在  ${\rm sp}^3$ 百分 比小于 20% 的范围内对 sp<sup>3</sup> 含量作出较为准确的判 断,而在大的范围内, $I_{\rm D}/I_{\rm G}$ 值只能对 sp<sup>3</sup>含量作出定 性判断。文中的实验数据以及笔者前期研究结果<sup>[8]</sup>证 明,在高 sp<sup>3</sup> 含量的 DLC 薄膜中, 单纯利用 I<sub>D</sub>/I<sub>C</sub> 值 来判断 sp<sup>3</sup>含量存在很大问题。

## 2.3 半峰宽与硬度的关系

根据高斯拟合结果,得出样品 G 峰的半峰宽,图 3 给出了硬度与G峰半峰宽的关系ectinet ◎ 1994-2013根据高斯拟合结果。得出样品的 D。峰和 Gh峰所覆use



#### 图 3 维氏硬度与 G 峰半峰宽的关系

Fig. 3 Vicker hardness versus FWHM of G peak

可以看出,硬度与 G 峰半峰宽相关度良好,较大 的 G 峰半峰宽对应较高的硬度值。对图中的相关数 据进行线性拟合,拟合结果表明,硬度与 G 峰半峰宽 具有近似的线性关系。在 DLC 薄膜的拉曼谱中,G 峰 半峰宽总是随着薄膜无序度的增加而增加<sup>[9]</sup>。无氢 DLC 膜中的 sp<sup>2</sup> 键总体上是无序连接的,随着 sp<sup>3</sup> 组 分的增加,sp<sup>2</sup> 组分降低,使得 sp<sup>2</sup> 团簇尺寸减小,膜内 应力增加,键角混乱度增加,从而 G 峰不断宽化<sup>[10]</sup>。 因此,G 峰半峰宽与 sp<sup>3</sup> 含量,进而与 DLC 膜硬度有 可能存在较强的相关度。笔者的实验结果证明,G 峰 半峰宽与 DLC 膜硬度之间的相关度很高,因而可以通 过测量 G 峰半峰宽来定量测量无氢 DLC 膜中 sp<sup>3</sup> 的 含量。

但该方法仅适用于无氢 DLC 薄膜。对于含氢的 DLC 薄膜(\*C:H),由于 C—H 键的存在,使得 DLC 薄膜的内应力大大下降<sup>[11]</sup>,sp<sup>2</sup> 团簇受应力影响而发 生的键角无序效应得到缓解,因此,sp<sup>2</sup> 的无序度和 G 峰的半峰宽受 DLC 薄膜中氢含量的影响严重。所以, 在含氢的 DLC 薄膜中,G 峰的半峰宽与 sp<sup>3</sup> 含量的相 关性无法得到保证,故此方法不适用。

# 3 结论

对于  $sp^3$ 所占百分比高于 20%的 DLC 薄膜, D 峰

表面技术 SURFACE TECHNOLOGY

和 G 峰的强度比值( $I_{\rm D}/I_{\rm C}$ )对 sp<sup>3</sup> 含量的变化不敏感, 因此采用  $I_{\rm D}/I_{\rm C}$  表征方法测量 sp<sup>3</sup> 含量 会失去 准确 性。文中证实 G 峰半峰宽与 DLC 的硬度具有良好的 线性关系,进而推断出 G 峰半峰宽与 sp<sup>3</sup> 含量具有良 好的线性关系。因此,可以通过 G 峰半峰宽在大范围 内测量 sp<sup>3</sup> 的含量。该方法只适用于无氢 DLC 薄膜。

#### [参考文献]

- Robertson J. Diamond-like Amorphous Carbon [J]. Materials Science and Engineering R, 2002, 37: 129-281.
- [2] 邓新绿,马国佳. 类金刚石膜的应用及制备[J]. 真空, 2002(5):27-31.
- [3] Wang F M, Chen M W, Lai Q B. Metallic Contacts to Nitrogen and Boron Doped Diamond-like Carbon Films
   [J]. Thin Solid Films, 2010, 518(12):3332-3336.
- [4] 程翔. 类金刚石薄膜光电性质研究与 MSM 光电器件探索[D]. 厦门:厦门大学, 2004.
- [5] Kawai S, Shinagawa T, Noda M, et al. Photoconductivity of DLC Film Deposited by Pulsed Discharge Plasma CVD [J]. Diamond & Related Materials, 2008, 17: 676–679.
- [6] 齐海成, 冯克成, 杨思泽. 射频输入功率对类金刚石薄膜 性能的影响[J]. 表面技术, 2009, 38(3):41-43.
- [7] 陈莲华,车晓舟,王平,等.FCVA法沉积的超薄类金刚石 薄膜的结构与热稳定性[J].真空科学与技术学报,2009, 29(3):318-323.
- [8] Ferrari A C, Robertson J. Interpretation of Raman Speetra of Disordered and Amorphous Carbon [J]. Physical Review B, 2000, 61(20): 14095- 14107.
- [9] Ferrari A C, Rodil S E, Robertson J. Interpretation of Infrared and Raman Spectra of Amorphous Carbon Nitrides[J]. Physical Review B, 2003, 67: 1- 20.
- [10] Schwan J, Ulrich S, Batori V, et al. Raman Spectroscopy on Amorphous Carbon Films [J]. Appl Phys, 1996, 80: 440-447.
- [11] Ferrari A C, Robertson J. 碳材料的拉曼光谱——从纳米
  管到金刚石[M]. 谭平恒,李峰,成会明译. 北京: 化学工
  业出版社, 2007: 194.

(上接第93页)

- [3] 费振义, 刘如伟, 王东江, 等. 船舶与集装箱用钢板预处理
  过程中所用磨料的对比[J]. 材料开发与应用, 1996, 11
  (6):13-14.
- [4] 舒型武. 钢渣特性及其综合利用技术[J]. 钢铁技术, 2007 (6):48-49.
- [5] 赵俊学. 冶金原理[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2002.
- [6] 欧阳东,谢宇平,何俊元.转炉钢渣的组成、矿物形貌及胶凝特性[J].硅酸盐学报,1991,19(6):489-494.

1997(2): 36-38.

- [8] 胡长春.船体除锈高效磨料[J].华中科技大学学报(自然 科学版),1983(S1):159-170.
- [9] 都昌林,易春龙.钢桥面无尘喷砂除锈设备及施工工艺[J].表面技术,2004,33(2):46-49.
- [10] 王志升. 矿渣除锈在车辆检修中的应用[J]. 铁道车辆, 1995, 33(9):58-59.
- [11] 胡东风,仵增瑞. 转炉钢渣风碎技术在石钢 30t 转炉的应

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House, All rights reserved. http://www.chki.net